# 固体高分子形燃料電池に用いる Nb 酸化物をベースとした 非白金酸素還元触媒の XAFS 局所構造解析 XAFS studies of niobium oxide-based compounds as non- platinum electrocatalysts for polymer electrolyte fuel cell

<u>石原 顕光</u><sup>a</sup>, 田村 基子<sup>a</sup>, 松本 匡史<sup>b</sup>, 今井 英人<sup>b</sup>, 太田 健一郎<sup>a</sup> <u>Akimitsu Ishihara</u><sup>a</sup>, Motoko Tamura<sup>a</sup>, Masashi Matsumoto<sup>b</sup>, Hideto Imai<sup>b</sup>, Ken-ichiro Ota<sup>a</sup>

> <sup>a</sup>国立大学法人 横浜国立大学,<sup>b</sup>日本電気株式会社 <sup>a</sup>Yokohama National University, <sup>b</sup>NEC corporation

固体高分子形燃料電池の白金代替材料として有望な部分酸化したニオブ炭窒化物の XAFS 局所 構造解析を行った。触媒粉末粒子全体の情報を得る透過法と、表面近傍の情報が得られる転換電 子収量法を用いて、内部と表面の情報を分離して得ることを試みた。その結果、転換電子収量法 を用いれば、表面近傍の情報を得ることができ、それから得られる情報は触媒能と良い相関があ ることがわかった。また、酸素還元触媒能を持つ、部分酸化したニオブ炭窒化物は、XRD ではほ ぼ完全酸化物 Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> と同定されるが、局所的な構造は大きく異なっており、酸素欠損の存在が示 唆された。

キーワード:燃料電池、非白金触媒、酸化物電極触媒、酸素還元反応

## 背景と研究目的:

固体高分子形燃料電池(PEFC)は、出力密度が高く、作動温度が低いことから、移動車両用、小型コジェネレーション用として、活発な研究・開発が進められている。しかし、PEFC は空気極での酸素還元過電圧が大きく、エネルギー変換効率の大幅な低下を招いている。現在はカソード触媒として、白金系触媒が使用されているが、白金の推定資源埋蔵量は 39000 トンにすぎず、このままでは燃料電池自動車は主流になりえない。PEFC の本格普及のためには、白金に替わる、安定で高い酸素還元触媒能を持つ非白金系酸素還元触媒の実現という革新的なブレークスルーが待望されている。

著者らは、高い安定性を持つと予想される4及び5族遷移金属酸化物を中心とした化合物に注 目し、高い酸素還元触媒能を持つ粉末触媒の開発に成功してきた[1-6]。具体的には、Ta炭窒化物 を出発物質とし、低酸素雰囲気で熱処理を行うことにより、表面を部分酸化させ、炭窒化物を核 に、酸化物を殻に持つ構造の触媒を作製した。これらの部分酸化した炭窒化物粉末が高い酸素還 元触媒能及び安定性を持つことを見出した。この酸素還元触媒能を支配する表面物性は未だ十分 に明らかではなく、白金を凌駕する触媒の開発には、触媒能発現のメカニズムを解明することが 必須である。

そこで、Taと同属で、資源量がTaよりも一桁大きなNbに注目し、Taを超える触媒能を持た せることを試みてきた。その結果、NbもTaに匹敵する触媒能を持つことを明らかにした。さら なる高出力化のためには、活性点を特定し、高密度化を図ることが必要である。そこで、Nb酸化 物をベースとした化合物の酸素還元触媒能を発現する構造を絞り込むことを目的として実験を行 った。

#### 実験:

NbC<sub>0.5</sub>N<sub>0.5</sub>を出発物質として、 $10^4$ あるいは $10^3$  atm の酸素を含む N<sub>2</sub>ガスを100 cm<sup>3</sup> min<sup>-1</sup>でフ ローさせたチューブ式電気炉を用い、 $900^{\circ}$ Cで保持時間を変化させ、部分酸化処理を行った。XRD により、得られた試料の結晶構造を調べた。また Nb K 吸収端の透過法 XAFS 測定を行った。参 照物質として、出発物質である NbC<sub>0.5</sub>N<sub>0.5</sub>粉末、NbC、NbN、完全酸化物である Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>を測定し た。しかし、粒子径がミクロンオーダーと非常に大きいため、透過法ではほとんど内部の情報し か得られず、触媒能の本質である表面情報を得ることが困難である。そこで、透過法に加えて転 換電子収量法も用いて表面層の情報を抽出することを試み、両者を比較した。

三電極式セルを用い 0.1 mol dm<sup>-3</sup> 硫酸水溶液中、30℃で電気化学測定を行った。作用極は、粉 末触媒 2.8 mg を  $\varphi$ =5.2 mm のグラッシーカーボン上に塗布、さらに希釈 Nafion<sup>®</sup>溶液を塗布して作 製した。1.0-0.2 V の範囲において走査速度 5 mV s<sup>-1</sup> で Slow Scan Voltammetry を行った。電流密度 は幾何面積基準とし、酸素雰囲気から窒素雰囲気の電流密度を引いて酸素還元電流密度  $i_{ORR}$  とし た。参照極には可逆水素電極(RHE)を用いた。酸素還元触媒能の評価の指標として、 $i_{ORR}$  がー 0.2  $\mu$ A cm<sup>-2</sup> のときの電位を酸素還元開始電位  $E_{ORR}$  及び 0.6 V vs RHE での電流密度を用いた。

#### 結果および考察:

Fig.1 に、NbC<sub>0.5</sub>N<sub>0.5</sub>を出発物質として、 900°Cでの部分酸化処理の時間を変化させた 試料のXRD 回折パターンを示す。Fig.1 にお いて最下部が出発物質であり、上部ほど O<sub>2</sub> 分圧 10<sup>-4</sup> atm での保持時間が長い。最上部は O<sub>2</sub>分圧 10<sup>-3</sup> atm である。酸化が進行するにつ れて、Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> のピークが成長することがわか る。ここで、NbC<sub>0.5</sub>N<sub>0.5</sub>からの酸化の程度を表 す指標として酸化度(DOO: Degree Of Oxidation)を導入する。酸化度はNbC<sub>0.5</sub>N<sub>0.5</sub>の 最強ピーク強度である  $2\theta \approx 35^\circ$ のピーク強度 I [NbCN]と、Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> の最強ピーク強度である  $2\theta \approx 28.3^\circ$ のピーク強度 I [Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>]を用いて、 次式で定義した。

 $DOO=I[Nb_2O_5]/(I[NbCN]+I[Nb_2O_5])(1)$ (1)式より、DOO値は $NbC_{0.5}N_{0.5}$ では0、 $Nb_2O_5$ では1となる。Fig.1より、保持時間が長いほど DOO が増大し、酸化が進むことがわかる。 また $O_2$ 分圧が一桁高い $10^{-3}$  atm の場合はほぼ 完全に酸化が進行することがわかる。SEM 観 察により、粉末粒子の粒子径は、いずれもお よそミクロンオーダーであることを確認した。

Fig.2(a)に KB を 7wt%混合した触媒の DOO と酸素還元開始電位 EORR の関係を、(b)に 0.6V での酸素還元電流密度とDOOの関係を示す。 出発物質 NbC<sub>0.5</sub>N<sub>0.5</sub> (DOO=0)の E<sub>ORR</sub> は 0.6 V であり、活性は低い。また、完全酸化物 Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>(DOO=1)の場合も酸素還元触媒能が低 い。それに対して、部分酸化した触媒では、 DOO が 0 からわずかに 0.05 に増加するにつ れて、0.25 V におよぶ飛躍的な Eorr の向上が 観察された。さらに DOO が 0.05 以上では、 EORR が 0.85 V 以上の高い値をとった。すなわ ち、ある程度の部分酸化が進行すれば、高い 触媒能を持つようになると考えられる。電流 値に関しては、0.15付近で極大をとる。これ は、活性サイトの密度がこの付近で極大とな るためと考えられる。

Fig.3(a) 及び(b) に酸化の程度の異なる Nb-CNO 粉末の透過法及び転換電子収量法の Nb K 吸収端 XANES スペクトルを示す。図中 に DOO も示した。透過法で得られた XANES

Completely oxidized Nb<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (g) V.L.L.V (f) 50ł ⊐ (e) ntensity / a. 40ł (d) 30ł (c) 20h 7 (b) 10h γ (a) 0h 10 20 30 40 50 60 70 80

▼ NbCN (cubic) ∇ Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>(monoclinic)

Fig.1 XRD patterns of partially oxidized  $NbC_{0.5}N_{0.5}$  with different heat treatment time.



Fig.2 Dependence of (a)  $E_{\rm ORR}$  and (b)  $i_{\rm ORR}$  at 0.6 V on degree of oxidation.

スペクトルは、DOO とともに連続的に変化しており、よい相関を示している。これは DOO を定 義する XRD 及び透過法 XAFS はいずれも粒子全体の情報を与えるため両者は良い相関を示すの である。それに対して、転換電子収量法で得られた XANES スペクトルは、DOO のわずかな増加

で急激に変化し、DOO が 0.18 以上ではほとん ど変化しない。Nb では、転換電子収量法による 検出深さはおよそ 200nm 程度と見積もられる。 したがって、表面近傍 200nm 程度はわずかな DOO の増加でほとんど酸化してしまい、その後 は DOO が増加しても表面状態はほとんど変化 しないことを意味している。Fig.2 に示したよう に、電気化学的に評価した酸素還元触媒能は、 表面状態を反映するため、転換電子収量法の結 果とよく対応しており、このことから転換電子 収量法で、触媒反応に最も重要な表面近傍の測 定が可能であることが示された。

DOOが0.2に近い粉末の表面は酸化物が形成 していると考えられるが、その動径分布関数は、 完全酸化物とは異なっていた。実際にイオン化 ポテンシャルを測定すると、完全酸化物よりも 0.5 eV 程度低い値をとる。これらを考えると、 表面近傍に酸素欠損が存在すると考えられ、そ の酸素欠損が酸素分子の吸着サイトとして機能 し、酸素還元触媒能を発現させているものと考 えられる。しかしながら、ニオブ酸化物の構造 は複雑であり、結晶格子内の酸素欠損の場所を 特定するには到っていない。

#### 今後の課題:

部分酸化したニオブ炭窒化物が、高い酸素還 元触媒能を持ち、PEFC 用非白金触媒として有 望であることを示した。その触媒能を発現させ



Fig.3 (a)XANES spectra taken in transmission mode. (b)CEY-XAS XANES spectra.

る局所構造を議論するために、XAFS 測定を行った。特に、粒子全体の情報が得られる透過法と ともに、表面近傍の情報が得られる転換電子収量法も試みた。その結果、透過法と転換電子収量 法を組み合わせることにより、触媒粒子全体の情報と表面近傍の情報を区別して得られることが 明らかとなった。転換電子収量法から得られるスペクトルは、酸素還元触媒能と良い相関を示し、 触媒能の発現に寄与する表面近傍の情報が選択的に得られた。触媒活性を持つ触媒粉末の表面は、 酸化状態にあるが、その動径分布関数は完全酸化物と異なっており、酸素欠損の存在を予想させ た。しかしながら、ニオブ酸化物は複雑な構造をしており、酸素欠損の部位を特定することが困 難な状況にある。今後は、さらに詳細な検討を行うことにより、酸素欠損を特定し、さらに、触 媒能を発現する酸素欠損を密度高く有する粉末触媒を作製する指針を提示したいと考えている。

### 参考文献:

- [1] A. Ishihara, K. Lee, S. Doi, S. Mitsushima, N. Kamiya, M. Hara, K. Domen, K. Fukuda and K. Ota, *Electrochem. Solid-State Lett.*, 8, A201 (2005).
- [2] S. Doi, A. Ishihara, S. Mitsushima, N. Kamiya, and K. Ota, J. Electrochem. Soc., 154, B362 (2007).
- [3] A. Ishihara, Y. Shibata, S. Mitsushima, and K. Ota, J. Electrochem. Soc, 155, B400 (2008).
- [4] A. Ishihara, M. Tamura, K. Matsuzawa, S. Mitsushima, and K. Ota, *Electrochim. Acta*, in press.
- [5] A. Ishihara, Y. Ohgi, K. Matsuzawa, S. Mitsushima, and K. Ota, *Electrochim. Acta*, in press.
- [6] H. Imai, M. Matsumoto, T. Miyazaki, S. Fujieda, A. Ishihara, M. Tamura, and K. Ota, *Appl. Phys. Lett.*, 96, 191905 (2010).